

AMC0386-Q1 車載、高精度、高電圧入力、外部クロック搭載、強化絶縁型デルタシグマ変調器

1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
 - 温度グレード 1: -40°C ~ 125°C, T_A
- 外付け抵抗なしで AC または DC 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
- 電源電圧範囲:
 - ハイサイド (AVDD): 3.0V ~ 5.5V
 - ローサイド (DVDD): 2.7V ~ 5.5V
- 小さい DC 誤差:
 - オフセット誤差: $\pm 0.9\text{mV}$ (最大値)
 - オフセットドリフト: $\pm 7\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (最大値)
 - 減衰誤差: $\pm 0.25\%$ (最大値)
 - 減衰ドリフト: $\pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (最大値)
- 高 CMTI: 150V/ns (最小値)
- ハイサイド電源喪失の検出
- 低 EMI: CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
- 利用可能な入力オプション:
 - AMC0386M06-Q1: $\pm 600\text{V}$, $10\text{M}\Omega$
 - AMC0386M06-Q1: $\pm 1000\text{V}$, $12.5\text{M}\Omega$
- 安全関連認証:
 - DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧: 7000V_{PK}
 - UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: $5000\text{V}_{\text{RMS}}$ (1 分間)

2 アプリケーション

- トラクションインバータ
- オンボードチャージャ
- DC/DC コンバータ
- バッテリジャンクションボックス

3 概要

AMC0386-Q1 は、高電圧、高インピーダンス入力、外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタシグマ ($\Delta\Sigma$) 変調器です。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kV_{RMS} (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。

AMC0386-Q1 の出力ビットストリームは、内部で生成される 10 MHz クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 14.8 (分解能の実効ビット数)、または 89dB のダイナミックレンジ (サンプリングレート 39kSPS) を実現します。

AMC0386-Q1 は、その内蔵抵抗分圧器、非常に高い DC 精度、低い温度ドリフト、高い安定性により、システムレベルのキャリブレーションなしに、寿命および温度を通して 1% 未満の高精度を実現します。

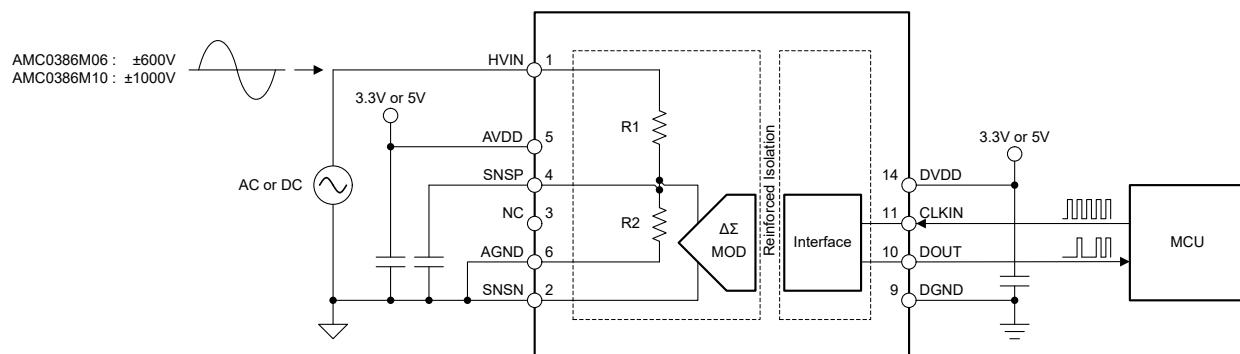
AMC0386-Q1 は 15 ピン、0.65mm ピッチの SSOP パッケージで供給され、-40°C ~ +125°C の温度範囲で完全に動作が規定されています。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
AMC0386-Q1	DFX (SSOP, 15)	12.8mm × 10.3mm

(1) 詳細については、「[メカニカル、パッケージ、および注文情報](#)」を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。



代表的なアプリケーション



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: [SBASAZ5](#)

目次

1 特長	1	7.1 概要	22
2 アプリケーション	1	7.2 機能ブロック図	22
3 概要	1	7.3 機能説明	23
4 デバイス比較表	3	7.4 デバイスの機能モード	27
5 ピン構成および機能	4	8 アプリケーションと実装	28
6 仕様	5	8.1 アプリケーション情報	28
6.1 絶対最大定格	5	8.2 代表的なアプリケーション	28
6.2 ESD 定格	5	8.3 設計のベスト プラクティス	31
6.3 推奨動作条件	6	8.4 電源に関する推奨事項	31
6.4 熱に関する情報	7	8.5 レイアウト	32
6.5 電力定格	7	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	33
6.6 絶縁仕様	8	9.1 ドキュメントのサポート	33
6.7 安全性関連認証	9	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	33
6.8 安全限界値	9	9.3 サポート・リソース	33
6.9 電気的特性	10	9.4 商標	33
6.10 スイッチング特性	12	9.5 静電気放電に関する注意事項	33
6.11 タイミング図	12	9.6 用語集	33
6.12 絶縁特性曲線	13	10 改訂履歴	33
6.13 代表的特性	14	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	33
7 詳細説明	22		

4 デバイス比較表

表 4-1. デバイスの比較

デバイス	R1 ⁽¹⁾	R2 ⁽¹⁾	分圧比	リニア入力範囲	クリッピング電圧	絶対最大入力電圧
AMC0386M06-Q1	10MΩ	16.6kΩ	601:1	±600V	±751V	±900V
AMC0386M10-Q1	12.5MΩ	12.5kΩ	1001:1	±1000V	±1251V	±1500V

(1) R1 と R2 は近似抵抗値であり、分圧比を正確に反映しません。

5 ピン構成および機能

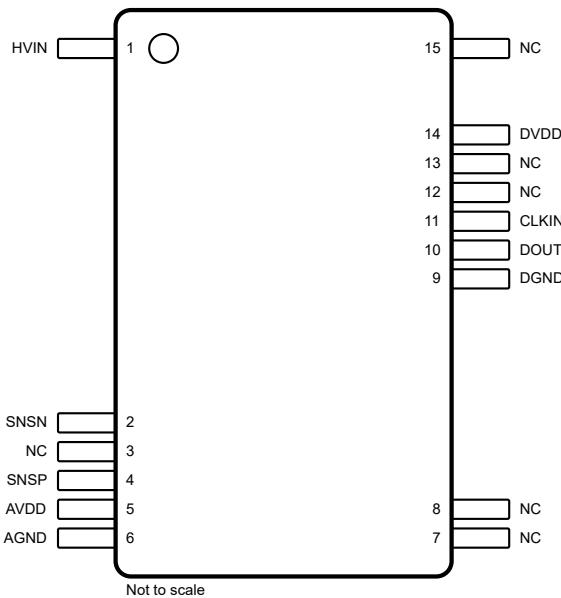


図 5-1. DFX パッケージ、15 ピン SOIC (上面図)

表 5-1. ピンの機能

ピン		タイプ	説明
番号	名称		
1	HVIN	アナログ入力	High 電圧入力
2	SNSN	アナログ入力	グランド センスピンと変調器アナログへの反転入力。AGND に接続。
3、7、8、12、 13、15	NC	該当なし	内部接続なし電位に接続するか、フローティングのまま維持。
4	SNSP	アナログ I/O	センス電圧ピンと変調器への非反転アナログ入力。外部フィルタ コンデンサに接続するか、フローティングのままにします。
5	AVDD	ハイサイド電源	アナログ (ハイサイド) 電源 ⁽¹⁾
6	AGND	ハイサイド グランド	アナログ (ハイサイド) グランド
9	DGND	ローサイド グランド	デジタル (ローサイド) グランド
10	DOUT	デジタル出力	変調器のデータ出力
11	CLKIN	デジタル入力	変調器クロック入力には、内部に $1.5M\Omega$ プルダウン抵抗があります。
14	DVDD	ローサイド電源	デジタル (ローサイド) 電源 ⁽¹⁾

(1) 電源のデカップリングに関する推奨事項については、「[電源に関する推奨事項](#)」セクションを参照してください。

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電源電圧	ハイサイド AVDD から AGND への接続	-0.3	6.5	V
	ローサイド DVDD から DGND への接続	-0.3	6.5	
アナログ入力電圧	HVIN から AGND への接続、AMC0386M06-Q1	-900	900	V
	HVIN から AGND への接続、AMC0386M10-Q1	-1500	1500	
アナログ入力電圧	SNSP、SNSN	AGND - 1.5	AVDD + 0.5	V
デジタル入力電圧	CLKIN	DGND - 0.5	DVDD + 0.5	V
デジタル出力電圧	DOUT	DGND - 0.5	DVDD + 0.5	V
入力電流	連続、電源ピンおよび HVIN ピンを除く任意のピン	-10	10	mA
温度	接合部、 T_J		150	°C
	保存、 T_{stg}	-65	150	

(1) 絶対最大定格の範囲外での動作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限りません。またその結果、本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります

6.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 ⁽¹⁾ HBM ESD 分類レベル 2 準拠	±2000	V
		デバイス帶電モデル (CDM)、AEC Q100-011、 CDM ESD 分類レベル C6 準拠	±1000	

(1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

6.3 推奨動作条件

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	公称値	最大値	単位
電源						
AVDD	ハイサイド電源	AVDD から AGND へ	3	5.0	5.5	V
DVDD	ローサイド電源	DVDD から DGND へ	2.7	3.3	5.5	V
アナログ入力						
$V_{Clipping}$	出力クリッピング前の公称入力電圧	SNSP を基準	-1.25	1.25		V
		HVIN を基準、AMC0386M06-Q1	-751	751		
		HVIN を基準、AMC0386M10-Q1	-1251	1251		
V_{FSR}	線形入力電圧を規定	SNSP を基準	-1	1		V
		HVIN を基準、AMC0386M06-Q1	-600	600		
		HVIN を基準、AMC0386M10-Q1	-1000	1000		
V_{IO}	デジタル入出力電圧		0	DVDD		V
f_{CLKIN}	入力クロック周波数		5	10	11	MHz
t_{HIGH}	入力クロック high 時間		40	50	110	ns
t_{LOW}	入力クロック low 時間		40	50	110	ns
温度範囲						
T_A	規定周囲温度		-40	125		°C

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		DFX (SSOP)	単位
		15 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	86.9	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	36.7	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	43.5	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	17	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	41.8	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

6.5 電力定格

パラメータ		テスト条件	値	単位
P_D	最大消費電力 (両サイド)	AVDD = DVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0386M06-Q1	150	mW
		AVDD = DVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0386M10-Q1	219	
P_{D1}	最大消費電力 (ハイサイド)	AVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0386M06-Q1	122	mW
		AVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0386M10-Q1	191	
P_{D2}	最大消費電力 (ローサイド)	DVDD = 5.5V	28	mW

6.6 絶縁仕様

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	値	単位
一般				
CLR	外部空間距離 ⁽¹⁾	空気中での最短のピン間距離	≥ 8	mm
CPG	外部沿面距離 ⁽¹⁾	パッケージ表面に沿った最短のピン間距離	≥ 9.7	mm
DTI	絶縁間の距離	二重絶縁の最小内部ギャップ (内部距離)	≥ 15.4	μm
CTI	比較トラッキング インデックス	DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112	≥ 600	V
	材料グループ	IEC 60664-1 に準拠	I	
	IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ	定格商用電源 V_{RMS} が 600V 以下	I-III	
		定格商用電源 V_{RMS} が 1000V 以下	I-II	
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)⁽²⁾				
V_{IORM}	最大反復ピーク絶縁電圧	AC 電圧で	2120	V_{PK}
V_{IOWM}	最大定格絶縁動作電圧	AC 電圧で (正弦波) DC 電圧で	1500 2120	V_{RMS} V_{DC}
V_{IOTM}	最大過渡絶縁電圧	$V_{TEST} = V_{IOTM}$ 、 $t = 60s$ (認定試験)、 $V_{TEST} = 1.2 \times V_{IOTM}$ 、 $t = 1s$ (100% 出荷時テスト)	7000	V_{PK}
V_{IMP}	最大インパルス電圧 ⁽³⁾	気中でテスト、IEC 62368-1 に準拠した 1.2/50μs の波形	7700	V_{PK}
V_{IOSM}	最大サーチ絶縁電圧 ⁽⁴⁾	IEC 62368-1 に準拠し油中でテスト (認定試験)、 1.2/50μs の波形	10000	V_{PK}
q_{pd}	見掛けの電荷 ⁽⁵⁾	手法 a、入力 / 出力安全性テストのサブグループ 2 および 3 の後、 $V_{pd(ini)} = V_{IOTM}$ 、 $t_{ini} = 60s$ 、 $V_{pd(m)} = 1.2 \times V_{IORM}$ 、 $t_m = 10s$	≤ 5	pC
		手法 a、環境テストのサブグループ 1 の後、 $V_{pd(ini)} = V_{IOTM}$ 、 $t_{ini} = 60s$ 、 $V_{pd(m)} = 1.6 \times V_{IORM}$ 、 $t_m = 10s$	≤ 5	
		手法 b1、事前条件設定 (タイプ テスト) およびルーチン テスト、 $V_{pd(ini)} = 1.2 \times V_{IOTM}$ 、 $t_{ini} = 1s$ 、 $V_{pd(m)} = 1.875 \times V_{IORM}$ 、 $t_m = 1s$	≤ 5	
		手法 b2、ルーチン テスト (100% 出荷時) ⁽⁷⁾ $V_{pd(ini)} = V_{pd(m)} = 1.2 \times V_{IOTM}$ 、 $t_{ini} = t_m = 1s$	≤ 5	
C_{IO}	バリア容量、 入力から出力 ⁽⁶⁾	$V_{IO} = 0.5V_{PP}$ (1MHz 時)	≈ 1.5	pF
R_{IO}	絶縁抵抗、 入力から出力 ⁽⁶⁾	$V_{IO} = 500V$ ($T_A = 25^\circ C$ 時)	$> 10^{12}$	Ω
		$V_{IO} = 500V$ ($100^\circ C \leq T_A \leq 125^\circ C$ 時)	$> 10^{11}$	
		$V_{IO} = 500V$ ($T_S = 150^\circ C$ 時)	$> 10^9$	
	汚染度		2	
	耐候性カテゴリ		55/125/21	
UL1577				
V_{ISO}	絶縁耐圧	$V_{TEST} = V_{ISO}$ 、 $t = 60s$ (認定試験)、 $V_{TEST} = 1.2 \times V_{ISO}$ 、 $t = 1s$ (100% 出荷時テスト)	5000	V_{RMS}

- (1) アプリケーションに固有の機器の絶縁規格に従って沿面距離および空間距離の要件を適用します。基板設計では、沿面距離および空間距離を維持し、プリント基板 (PCB) のアイソレータの取り付けパッドによりこの距離が短くならないよう注意が必要です。特定の場合には、PCB 上の沿面距離と空間距離は等しくなります。これらの規格値を増やすため、PCB 上にグループやリブを挿入するなどの技法が使用されます。
- (2) この絶縁素子は安全定格内の 安全な電気的絶縁のみに適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
- (3) テストは、パッケージのサーチ耐性を判定するため、空気中で実行されます。
- (4) テストは、絶縁バリアの固有サーチ耐性を判定するため、油中で実行されます。
- (5) 見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する放電です。
- (6) バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンは互いに接続され、実質的に 2 ピンのデバイスになります。
- (7) 正式運用環境では、手法 b1 または b2 のいずれかが使用されます。

6.7 安全性関連認証

VDE	UL
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、 EN IEC 60747-17、 DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1)、 EN IEC 62368-1、 IEC 62368-1 条項:5.4.3、5.4.4.4、5.4.9	1577 component および CSA component acceptance NO 5 programs により承認済み
強化絶縁	単一保護
認証書番号:保留中	ファイル番号:保留中

6.8 安全限界値

安全限界値⁽¹⁾の目的は、入力または出力回路の故障による絶縁バリアの損傷の可能性を最小限に抑えることです。I/O回路の故障により、グランドあるいは電源との抵抗が低くなることがあります。電流制限がないと、チップがオーバーヒートして絶縁バリアが破壊されるほどの大電力が消費され、ひいてはシステムの2次故障に到る可能性があります。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
I_{SI}	安全入力電流	$R_{\theta JA} = 86.9^{\circ}\text{C}/\text{W}$, $\text{AVDD} = \text{DVDD} = 5.5\text{V}$, $V_{\text{HVIN}} = V_{\text{Clipping}}$, $T_J = 150^{\circ}\text{C}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ AMC0386M06-Q1			250	mA
		$R_{\theta JA} = 86.9^{\circ}\text{C}/\text{W}$, $\text{AVDD} = \text{DVDD} = 5.5\text{V}$, $V_{\text{HVIN}} = V_{\text{Clipping}}$, $T_J = 150^{\circ}\text{C}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ AMC0386M10-Q1			240	
I_{SO}	安全出力電流	$R_{\theta JA} = 86.9^{\circ}\text{C}/\text{W}$, $\text{AVDD} = \text{DVDD} = 5.5\text{V}$, $V_{\text{HVIN}} = V_{\text{Clipping}}$, $T_J = 150^{\circ}\text{C}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$			260	mA
P_S	安全入力、出力、または合計電力	$R_{\theta JA} = 86.9^{\circ}\text{C}/\text{W}$, $T_J = 150^{\circ}\text{C}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$			1440	mW
T_S	最高安全温度				150	°C

(1) 最高安全温度 T_S は、本デバイスに規定された最大接合部温度 T_J と同じ値です。 I_S および P_S パラメータはそれぞれ安全電流と安全電力を表します。

I_S と P_S の上限値を超えないようにします。これらの制限値は周囲温度 T_A によって変化します。

「熱に関する情報」の表にある、接合部から外気への熱抵抗 $R_{\theta JA}$ は、

リード付き表面実装パッケージ用の高誘電率テスト基板に実装されたデバイスのものです。次の式を使用して、各パラメータの値を計算します。

$T_J = T_A + R_{\theta JA} \times P$ (P はデバイスで消費される電力)。

$T_{J(max)} = T_S = T_A + R_{\theta JA} \times P_S$ ($T_{J(max)}$ は最大接合部温度)。

$P_S = I_S \times VDD_{max}$ (VDD_{max} はハイサイドとローサイドの最大電源電圧)。

6.9 電気的特性

最小値と最大値の仕様は、 $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ 、 $\text{AVDD} = 3.0\text{V} \sim 5.5\text{V}$ 、 $\text{DVDD} = 2.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ 、 $V_{\text{SNSP}} = -1\text{V} \sim +1\text{V}$ 、および $V_{\text{SNSN}} = 0\text{V}$ に適用されます。標準的な仕様は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $\text{AVDD} = 5\text{V}$ 、 $\text{DVDD} = 3.3\text{V}$ 、および $f_{\text{CLKIN}} = 10\text{MHz}$ でのものです (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
アナログ入力						
R_{IN}	入力抵抗	AMC0386M06-Q1	10	$\text{M}\Omega$	12.5	
		AMC0386M10-Q1				
	公称抵抗分圧比	$V_{\text{HVIN}} / V_{\text{SNSP}}$ 、AMC0386M06-Q1	598	601	604	
		$V_{\text{HVIN}} / V_{\text{SNSP}}$ 、AMC0386M10-Q1	997	1001	1005	
CMTI	同相過渡耐性		150			V/ns
DC 精度						
E_{O}	入力オフセット誤差	SNSP を基準、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $\text{HVIN} = \text{AGND}$	-0.9	± 0.08	0.9	mV
		HVIN を基準、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $\text{HVIN} = \text{AGND}$	-540	± 50	540	
		HVIN を基準、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $\text{HVIN} = \text{AGND}$	-900	± 80	900	
TCE _O	オフセット誤差の温度ドリフト ⁽³⁾	SNSP を基準、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $\text{HVIN} = \text{AGND}$	0.0035	0.007		$\text{mV}/^\circ\text{C}$
		HVIN を基準、 $\text{HVIN} = \text{AGND}$ AMC0386M06-Q1	2.1	4.2		
		HVIN を基準、 $\text{HVIN} = \text{AGND}$ AMC0386M10-Q1	3.5	7		
E_{A}	減衰誤差 ^{(1) (6)}	$T_A = 25^\circ\text{C}$	-0.25	± 0.02	0.25	%
TCE _A	減衰誤差の温度ドリフト ⁽⁴⁾		-30	± 8	30	$\text{ppm}/^\circ\text{C}$
INL	積分非線形性 ⁽²⁾	分解能: 16 ビット	-9	± 1.9	9	LSB
DNL	微分非直線性	分解能: 16 ビット	-0.99		0.99	LSB
PSRR	電源除去比 ⁽⁵⁾	AVDD DC PSRR、 $\text{HVIN} = \text{AGND}$ 、 $\text{AVDD} = 3.0\text{V} \sim 5.5\text{V}$		-83		dB
		AVDD AC PSRR、 $\text{HVIN} = \text{AGND}$ 、 AVDD リップル 10kHz/100mV		-54		
AC 精度						
SNR	信号対雑音比	$V_{\text{SNSP}} = 2V_{\text{PP}}$ 、 $\text{SNSN} = \text{AGND}$ 、 $f_{\text{IN}} = 1\text{kHz}$	84.5	89		dB
SINAD	信号対雑音 + 歪み	$V_{\text{SNSP}} = 2V_{\text{PP}}$ 、 $\text{SNSN} = \text{AGND}$ 、 $f_{\text{IN}} = 1\text{kHz}$	76	84		dB
THD	全高調波歪	$V_{\text{SNSP}} = 2V_{\text{PP}}$ 、 $\text{SNSN} = \text{AGND}$ 、 $f_{\text{IN}} = 1\text{kHz}$	-88	-77		dB
デジタル入力 (シュミットトリガ付き CMOS ロジック)						
I_{IN}	入力電流	$\text{DGND} \leq V_{\text{IN}} \leq \text{DVDD}$		7		μA
C_{IN}	入力容量			4		pF
V_{IH}	High レベル入力電圧		0.7 x DVDD	DVDD + 0.3		V
V_{IL}	Low レベル入力電圧		-0.3	0.3 x DVDD		V
デジタル出力 (CMOS)						
C_{LOAD}	出力負荷容量	$f_{\text{CLKIN}} = 10\text{MHz}$		15	30	pF
V_{OH}	High レベル出力電圧	$I_{\text{OH}} = -4\text{mA}$	DVDD - 0.4			V
V_{OL}	Low レベル出力電圧	$I_{\text{OL}} = 4\text{mA}$		0.4		V
電源						
I_{AVDD}	ハイサイド電源電流			5.3	7	mA
I_{DVDD}	ローサイド電源電流	$C_{\text{LOAD}} = 15\text{pF}$		3.6	5	mA
AVDD _{UV}	ハイサイド低電圧検出スレッショルド	AVDD 立ち上がり、	2.4	2.6	2.8	V
		AVDD 立ち下がり、	1.9	2.05	2.2	
DVDD _{UV}	ローサイドの低電圧検出スレッショルド	DVDD 立ち上がり	2.3	2.5	2.7	V
		DVDD 立ち下がり、	1.9	2.05	2.2	

(1) 標準値には、1 つのシグマの統計的変動が含まれます。

- (2) 積分非線形性は、LSB の数、または指定された線形性を有する入力電圧範囲 FSR のパーセンテージとして表される、理想的な ADC 伝達関数の終点を通過する直線からの、最大偏移と定義されます。
- (3) オフセット誤差ドリフトは、
 $TCE_O = (value_{MAX} - value_{MIN}) / TempRange$ の式で説明されるボックス方式を使用して計算されます。
- (4) 減衰誤差ドリフトは、ボックス手法を使用して計算され、次の数式で記述されます。
 $TCE_G (\text{ppm}) = ((value_{MAX} - value_{MIN}) / (value \times TempRange)) \times 10^6$
- (5) このパラメータは SNSP を基準にしています。
- (6) 入力側の分圧抵抗からの誤差を含みます。

6.10 スイッチング特性

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t_H	CLKIN 立ち上がりエッジ後の DOUT ホールド時間	$C_{LOAD} = 15\text{pF}$		10		ns
t_D	CLKIN の立ち上がりエッジから DOUT 有効までの遅延	$C_{LOAD} = 15\text{pF}$		35		ns
t_r	DOUT の立ち上がり時間	10% ~ 90%、 $2.7\text{V} \leq DVDD \leq 3.6\text{V}$ 、 $C_{LOAD} = 15\text{pF}$		2.5	6	ns
		10% ~ 90%、 $4.5\text{V} \leq DVDD \leq 5.5\text{V}$ 、 $C_{LOAD} = 15\text{pF}$		3.2	6	
t_f	DOUT の立ち下がり時間	10% ~ 90%、 $2.7\text{V} \leq DVDD \leq 3.6\text{V}$ 、 $C_{LOAD} = 15\text{pF}$		2.2	6	ns
		10% ~ 90%、 $4.5\text{V} \leq DVDD \leq 5.5\text{V}$ 、 $C_{LOAD} = 15\text{pF}$		2.9	6	
t_{START}	デバイスの起動時間	$DVDD \geq 2.7\text{V}$ からビットストリームが有効、0.1% セリングで、AVDD が 0 から 3.0V までのステップ		30		μs

6.11 タイミング図

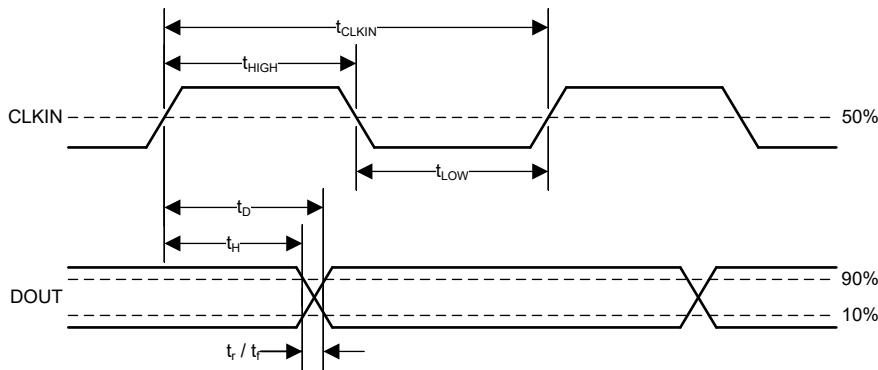


図 6-1. デジタルインターフェイスのタイミング

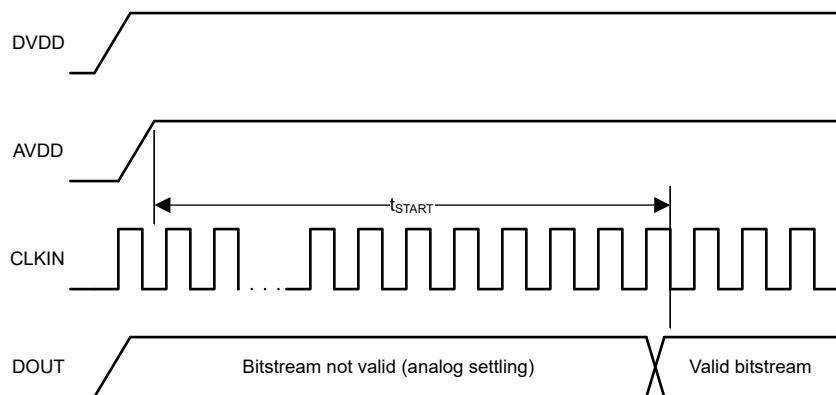


図 6-2. デバイスの起動時間

6.12 絶縁特性曲線

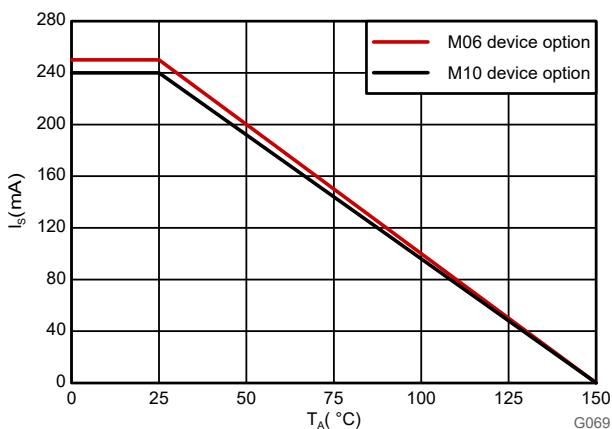


図 6-3. VDE に従う安全性制限電流の熱特性低下曲線

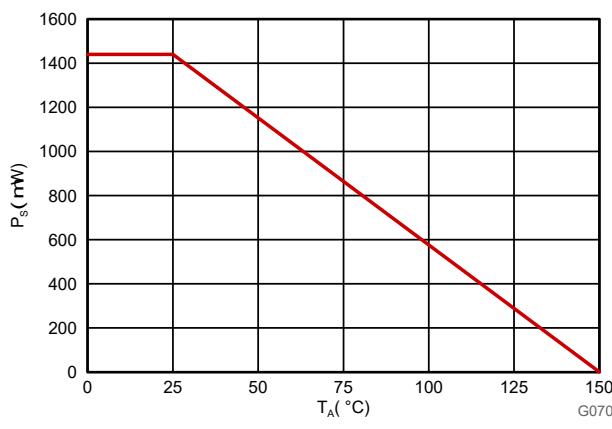
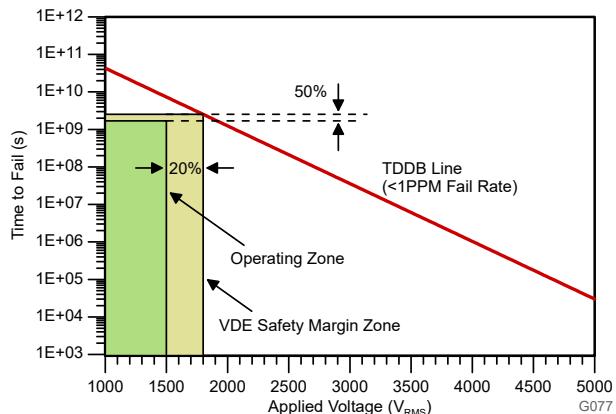


図 6-4. VDE に従う安全性制限電力の熱特性低下曲線



150°CまでのT_A、ストレス電圧周波数 = 60Hz、絶縁動作電圧 = 1500V_{RMS}、予測動作寿命 \geq 50 年

図 6-5. 強化絶縁コンデンサの寿命推定

6.13 代表的特性

AVDD = 5V, DVDD = 3.3V, $V_{SNSP} = -1V \sim 1V$, SNSN = AGND, OSR = 256 の sinc^3 フィルタ (特に記載がない限り)

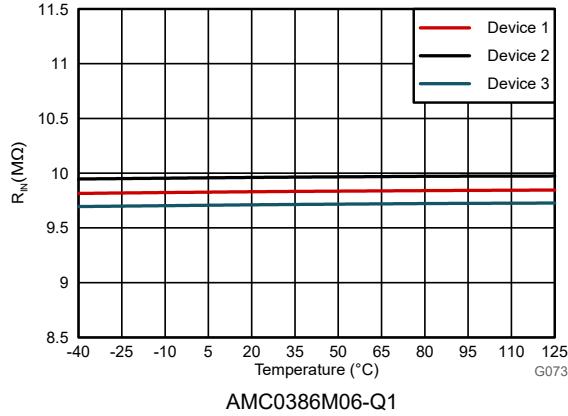


図 6-6. 入力抵抗と温度との関係

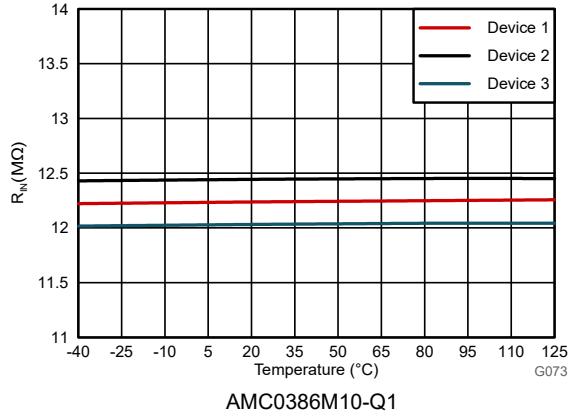


図 6-7. 入力抵抗と温度との関係

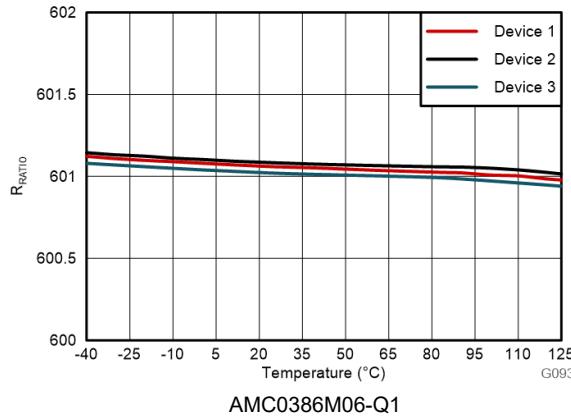


図 6-8. 分圧比と温度との関係

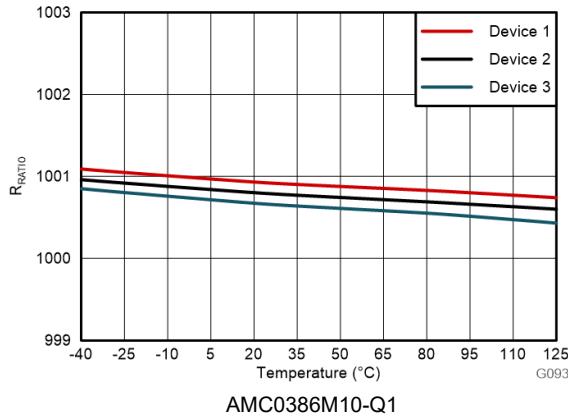


図 6-9. 分圧比と温度との関係

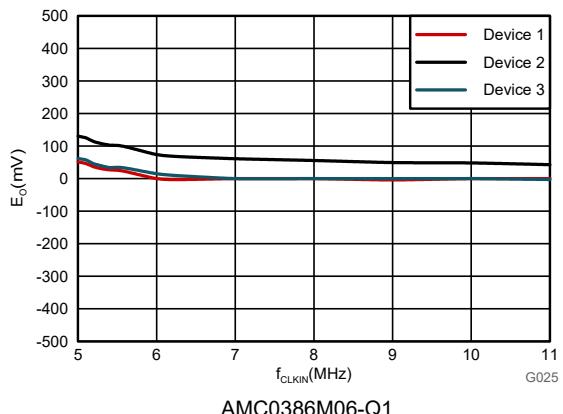


図 6-10. オフセット誤差とクロック周波数との関係

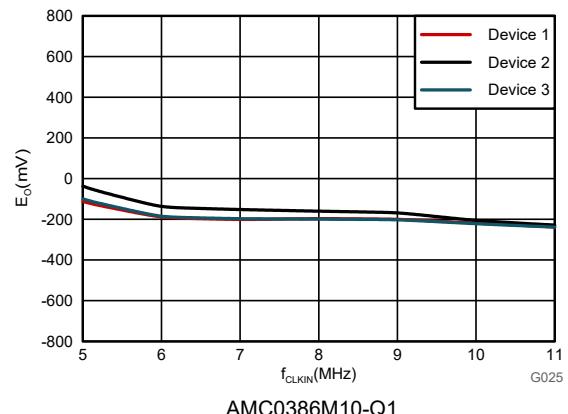
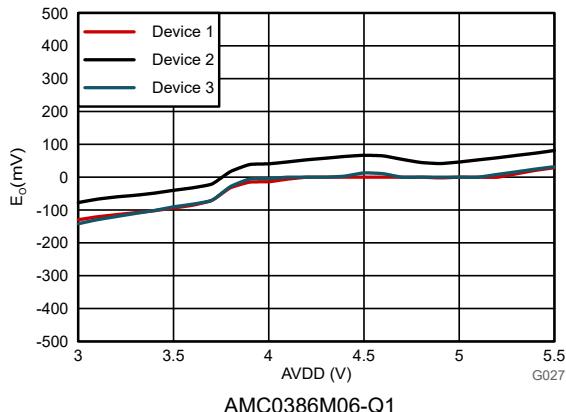


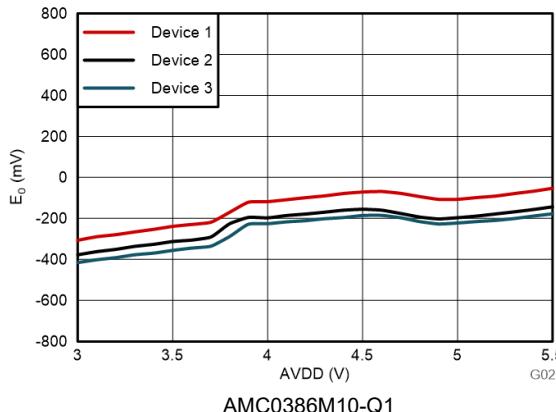
図 6-11. オフセット誤差とクロック周波数との関係

6.13 代表的特性 (続き)

AVDD = 5V, DVDD = 3.3V, $V_{SNSP} = -1V \sim 1V$, SNSN = AGND, OSR = 256 の sinc^3 フィルタ (特に記載がない限り)

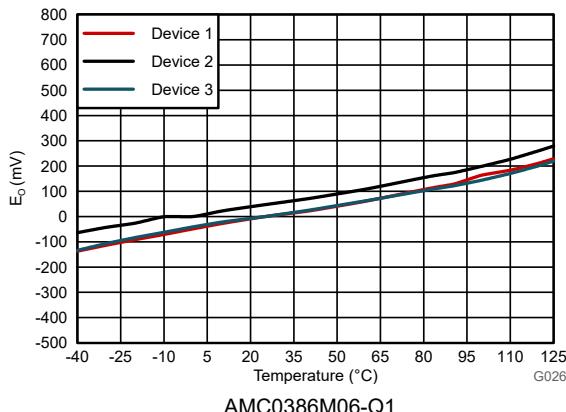


AMC0386M06-Q1



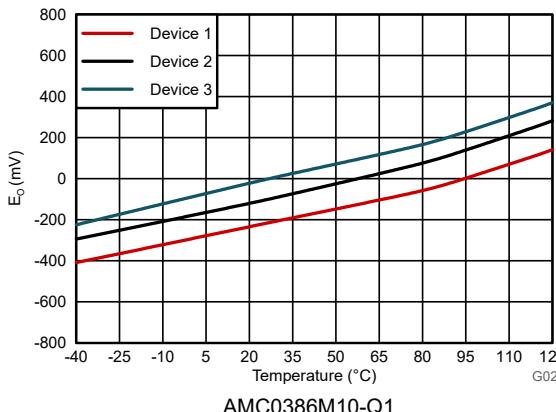
AMC0386M10-Q1

図 6-12. オフセット誤差と1次側電源電圧との関係



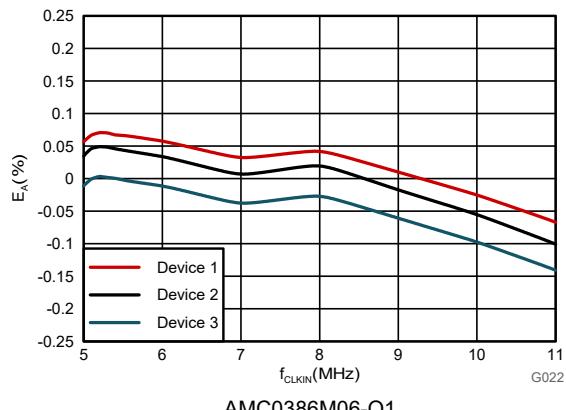
AMC0386M06-Q1

図 6-14. オフセット誤差と温度との関係



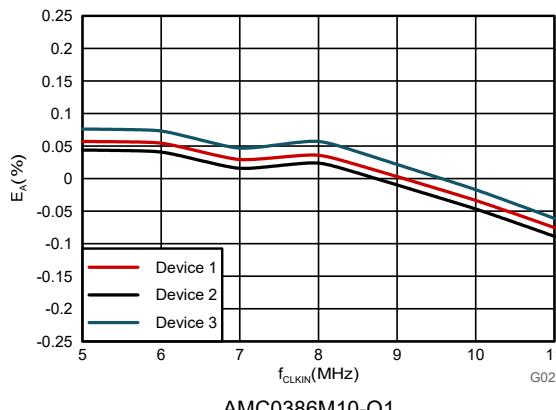
AMC0386M10-Q1

図 6-15. オフセット誤差と温度との関係



AMC0386M06-Q1

図 6-16. 減衰誤差とクロック周波数との関係



AMC0386M10-Q1

図 6-17. 減衰誤差とクロック周波数との関係

6.13 代表的特性 (続き)

AVDD = 5V, DVDD = 3.3V, $V_{SNSP} = -1V \sim 1V$, SNSN = AGND, OSR = 256 の sinc³ フィルタ (特に記載がない限り)

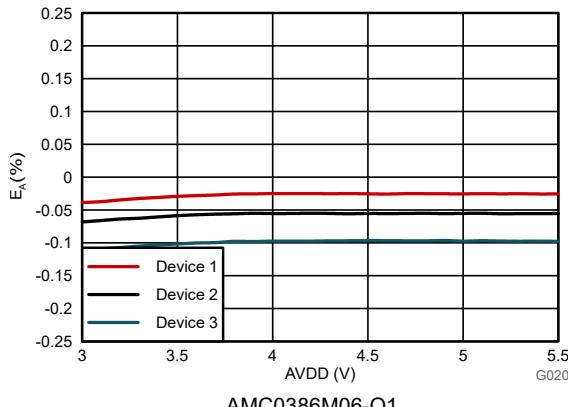


図 6-18. 減衰誤差とハイサイド電源電圧との関係

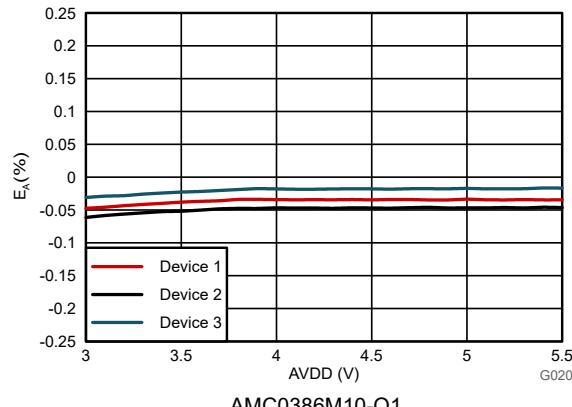


図 6-19. 減衰誤差とハイサイド電源電圧との関係

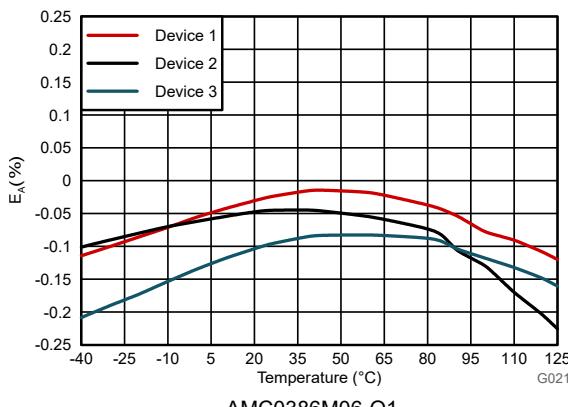


図 6-20. 減衰誤差と温度との関係

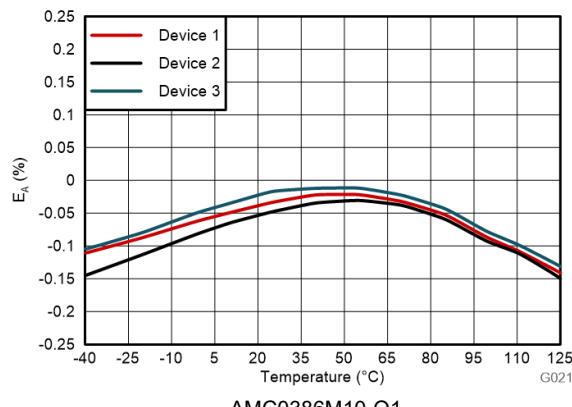


図 6-21. 減衰誤差と温度との関係

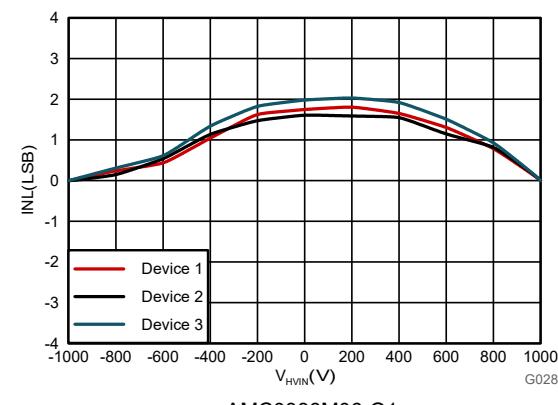


図 6-22. 積分非直線性と入力電圧との関係

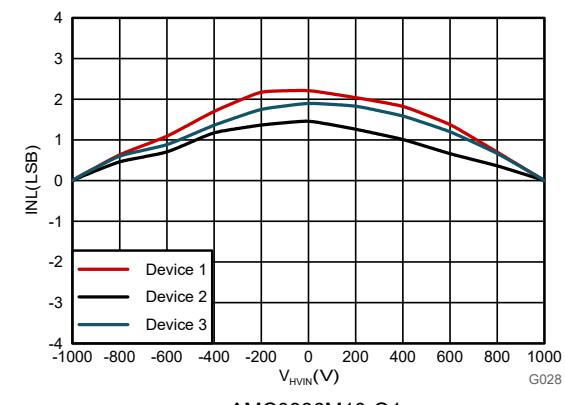


図 6-23. 積分非直線性と入力電圧との関係

6.13 代表的特性 (続き)

AVDD = 5V, DVDD = 3.3V, V_{SNSP} = -1V ~ 1V, SNSN = AGND, OSR = 256 の sinc³ フィルタ (特に記載がない限り)

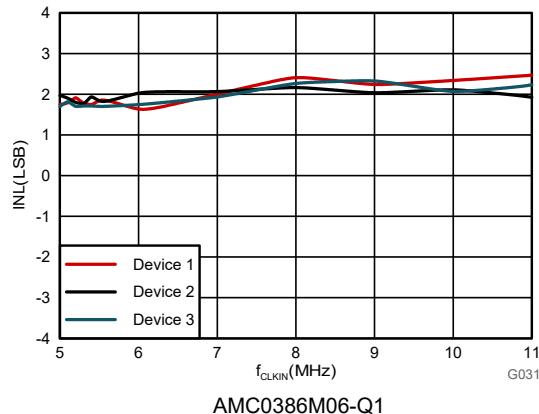


図 6-24. 積分非直線性とクロック周波数との関係

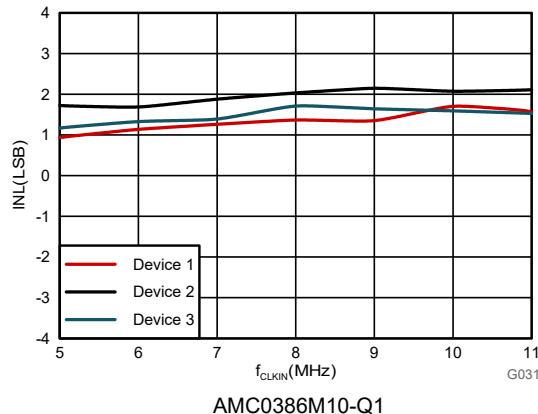


図 6-25. 積分非直線性とクロック周波数との関係

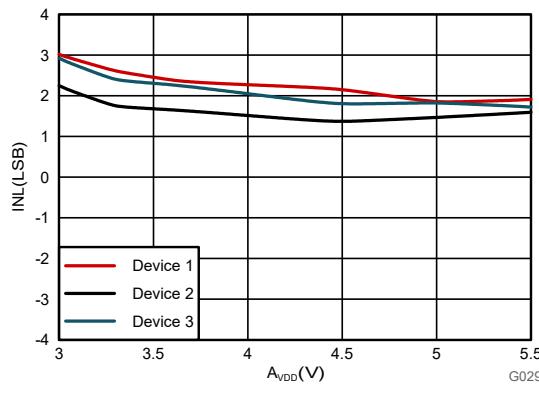


図 6-26. 積分非線形性と電源電圧との関係

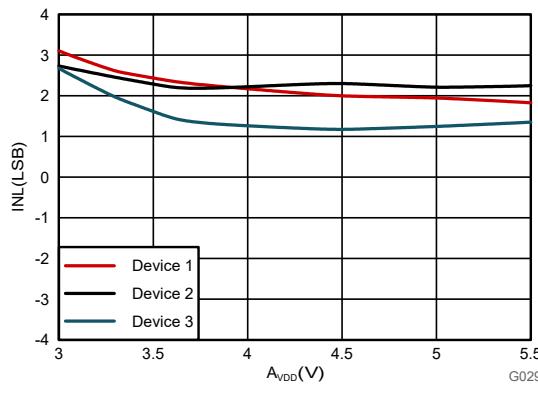


図 6-27. 積分非線形性と電源電圧との関係

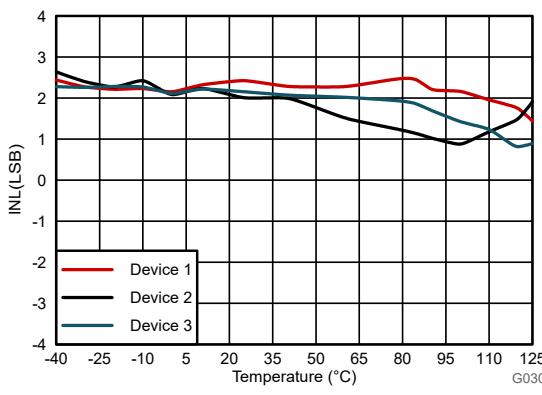


図 6-28. 積分非線形性と温度との関係

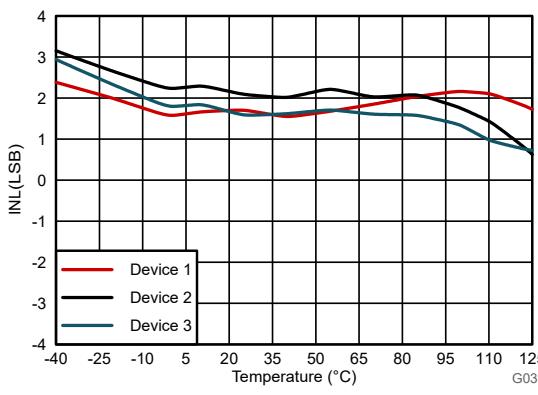


図 6-29. 積分非線形性と温度との関係

6.13 代表的特性 (続き)

AVDD = 5V, DVDD = 3.3V, $V_{SNSP} = -1V \sim 1V$, SNSN = AGND, OSR = 256 の sinc^3 フィルタ (特に記載がない限り)

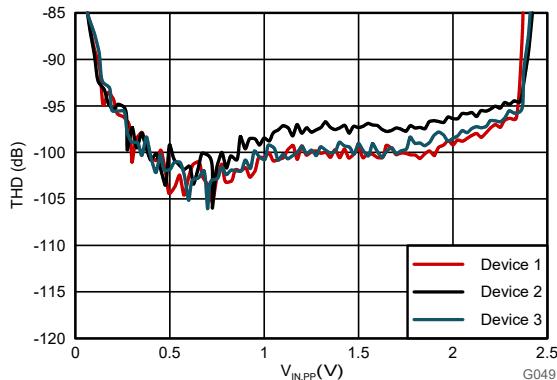


図 6-30. 全高調波歪みと入力信号振幅との関係

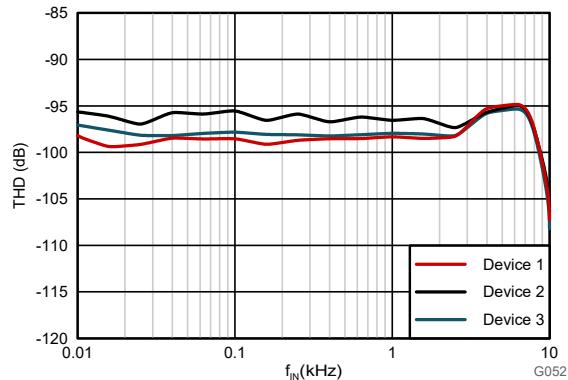


図 6-31. 全高調波歪みと入力信号周波数との関係

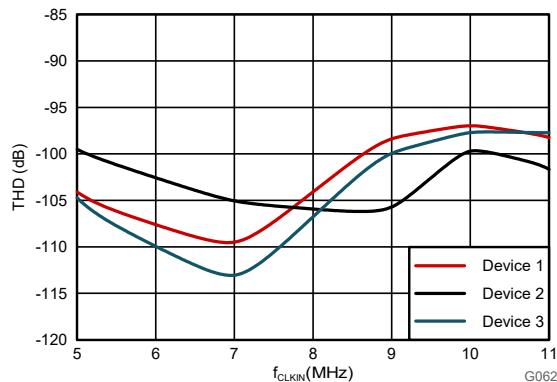


図 6-32. 全高調波歪とクロック周波数との関係

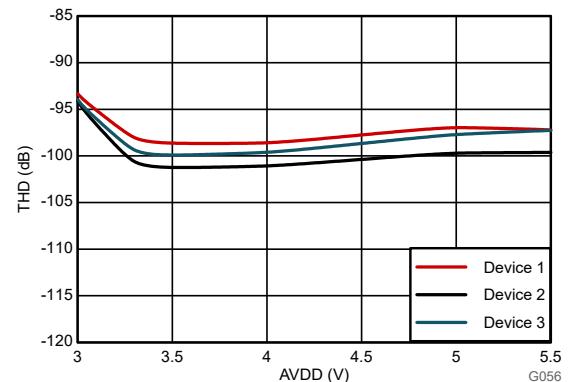


図 6-33. 全高調波歪みと1次側電源電圧との関係

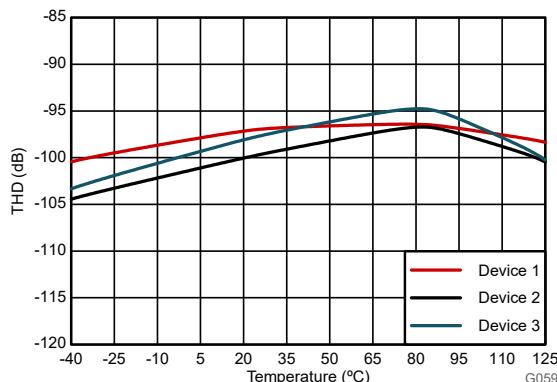


図 6-34. 全高調波歪みと温度との関係

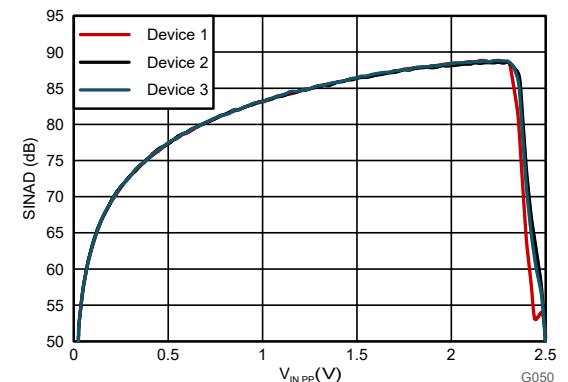


図 6-35. 信号対雑音比+歪みと入力信号振幅との関係

6.13 代表的特性 (続き)

AVDD = 5V, DVDD = 3.3V, V_{SNSP} = -1V ~ 1V, SNSN = AGND, OSR = 256 の sinc³ フィルタ (特に記載がない限り)

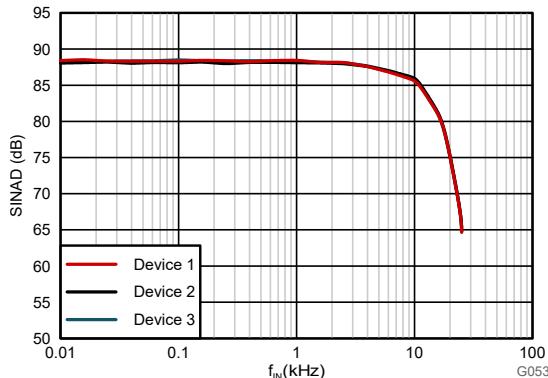


図 6-36. 信号対雑音比+歪みと入力信号周波数との関係

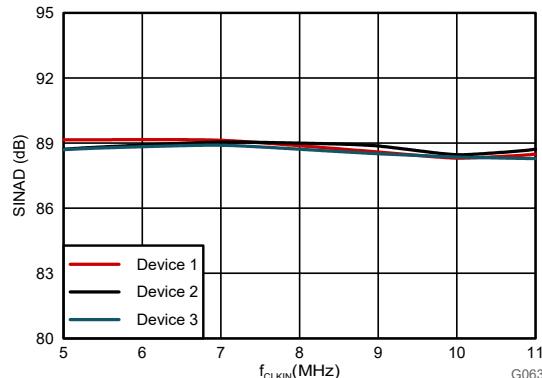


図 6-37. 信号対雑音比+歪みとクロック周波数との関係

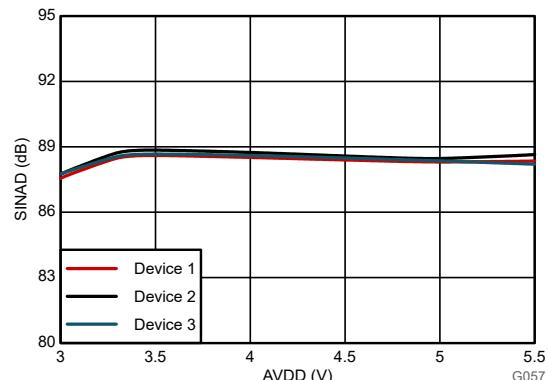


図 6-38. 信号対雑音比+歪みとハイサイド電源電圧との関係

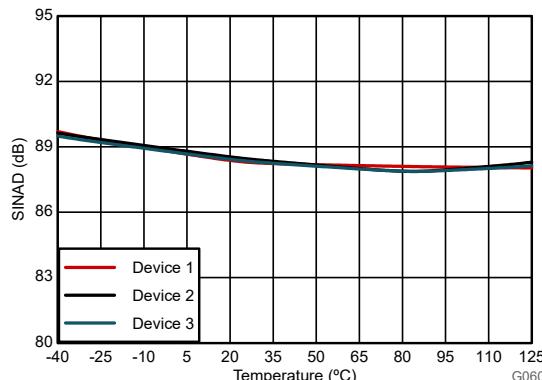


図 6-39. 信号対雑音比+歪みと温度との関係

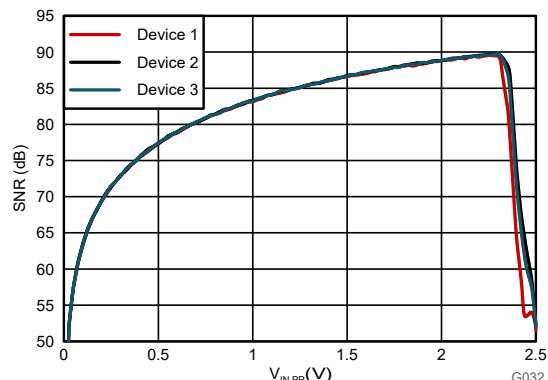


図 6-40. 信号対雑音比と入力信号振幅との関係

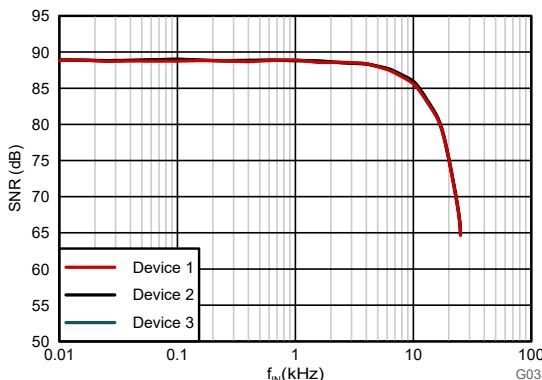


図 6-41. 信号対雑音比と入力信号周波数との関係

6.13 代表的特性 (続き)

AVDD = 5V, DVDD = 3.3V, $V_{SNSP} = -1V \sim 1V$, SNSN = AGND, OSR = 256 の sinc^3 フィルタ (特に記載がない限り)

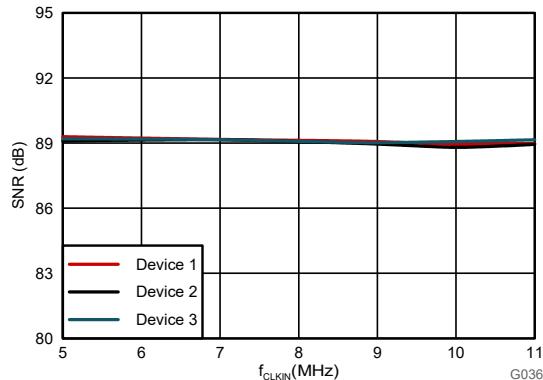


図 6-42. 信号対雑音比とクロック周波数との関係

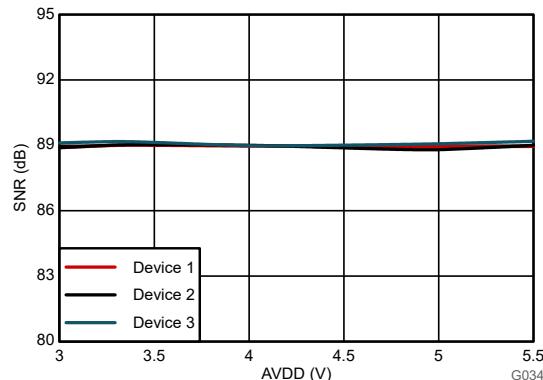


図 6-43. 信号対雑音比と 1 次側電源電圧との関係

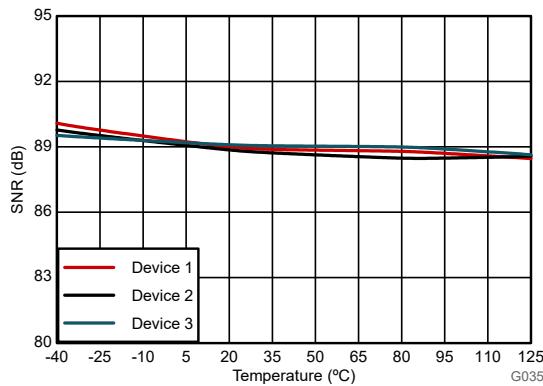


図 6-44. 信号対雑音比と温度との関係

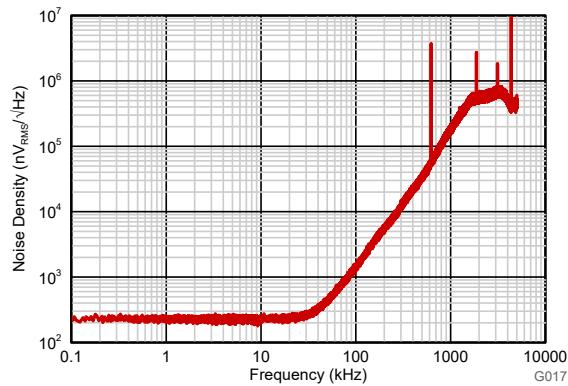


図 6-45. SNSP を AGND に短絡した場合のノイズ密度

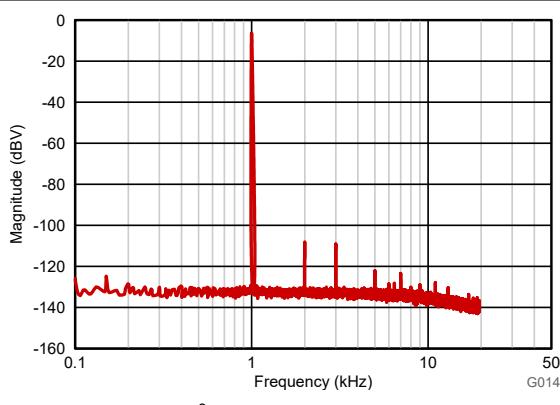


図 6-46. 1kHz 入力信号に対する周波数スペクトラム

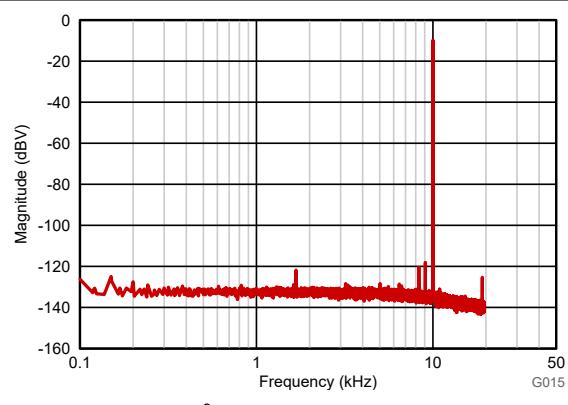


図 6-47. 10kHz 入力信号に対する周波数スペクトラム

6.13 代表的特性 (続き)

AVDD = 5V, DVDD = 3.3V, V_{SNSP} = -1V ~ 1V, SNSN = AGND, OSR = 256 の sinc³ フィルタ (特に記載がない限り)

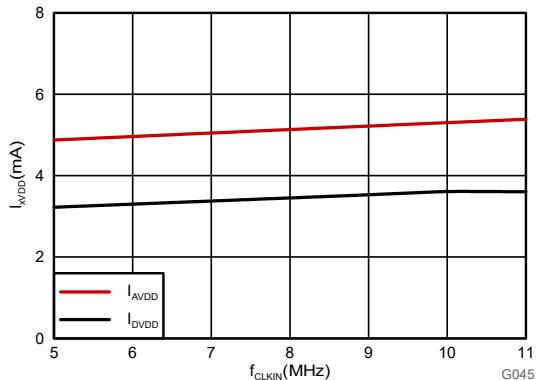


図 6-48. 消費電流とクロック周波数との関係

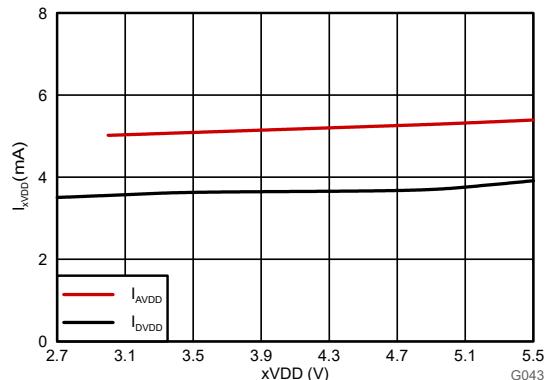


図 6-49. 電源電流と電源電圧との関係

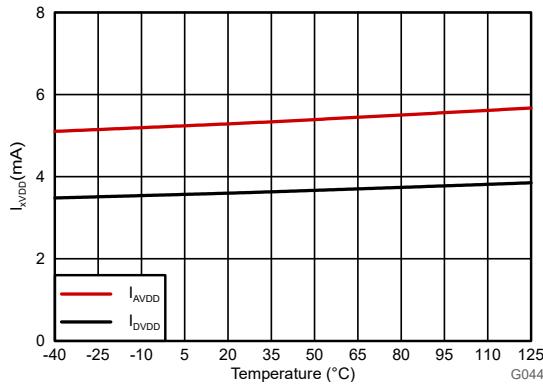


図 6-50. 電源電流と温度との関係

7 詳細説明

7.1 概要

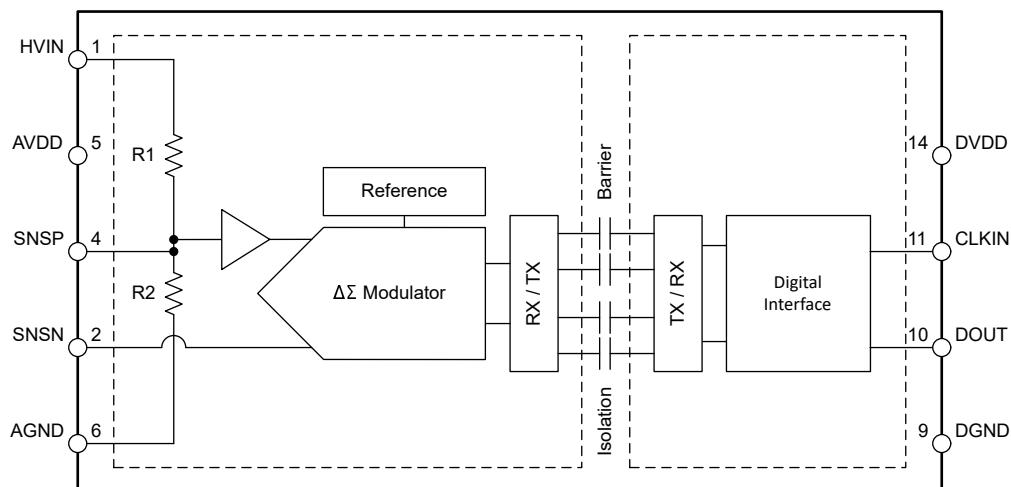
AMC0386-Q1 は、高インピーダンス入力を備えたシングル チャネル、2 次、CMOS デルタシグマ ($\Delta\Sigma$) 変調器であり、高分解能電圧測定向けに設計されています。コンバータの絶縁型出力 (DOUT) は、CLKIN ピンに印加される外部クロックに同期して、デジタル 1 および 0 のストリームを供給します。このシリアル出力の時間平均は、アナログ入力電圧に比例します。

変調器は量子化ノイズを高い周波数にシフトするため、全体的な性能を向上させるには、デバイス出力で Sinc フィルタなどのデジタルローパスデジタルフィルタを使用します。このフィルタは、高いサンプリング レートの 1 ビット データ ストリームを、より低いレートでビット数の多いデータ ワードに変換します(間引き)。フィルターを実装するには、マイクロコントローラ (μ C) またはフィールド プログラム可能ゲートアレイ (FPGA) を使用します。

全体的な性能 (速度と分解能) は、適切なオーバーサンプリング比 (OSR) とフィルタ タイプの選択によって異なります。OSR が高いほど分解能が高くなり、低いリフレッシュ レートで動作します。OSR が低いほど分解能は低くなりますが、データのリフレッシュ レートは高くなります。このシステムは、デジタル フィルタ設計による柔軟性が高く、OSR = 256 で 89dB を超えるダイナミックレンジを備えており、A/D 変換結果を得ることができます。

二酸化シリコン (SiO_2) ベースの容量性絶縁バリアは、高レベルの磁場耐性をサポートします。[ISO72x デジタルアイナレータの磁界耐性 アプリケーション ノート](#) を参照してください。AMC0386-Q1 はオン / オフ キーリング (OOK) 変調を使用して、絶縁バリアをまたぐデータを送信します。この変調と絶縁バリアの特性から、ノイズの多い環境で高い信頼性と、高い同過渡耐性が得られます。

7.2 機能ブロック図



7.3 機能説明

7.3.1 アナログ入力

AMC0386-Q1 の入力に抵抗分圧器は、HVIN ピンに印加される電圧を $\pm 1V$ 線形フルスケール レベルに分圧します。この信号は SNSP ピンで利用できます。これは、アナログシグナルチェーンの入力でもあります。

SNSP ピンの高インピーダンスの入力バッファは、2 次のスイッチング コンデンサ、フィードフォワード $\Delta\Sigma$ 変調器に電力を供給します。変調器は、[絶縁チャネルの信号伝送](#) セクションで説明されているように、アナログ信号をビットストリームに変換します。ビットストリームは、絶縁バリアをまたぐ転送されます。

オフセットおよびオフセット ドリフト係数を減らすため、入力バッファはチョッピング周波数を $f_{CLKIN}/16$ に設定してチョッパ安定化されます。10 MHz の変調器クロックのチョッピング周波数によって生成される 625 kHz のスプリアスを、図 7-1 に示します。

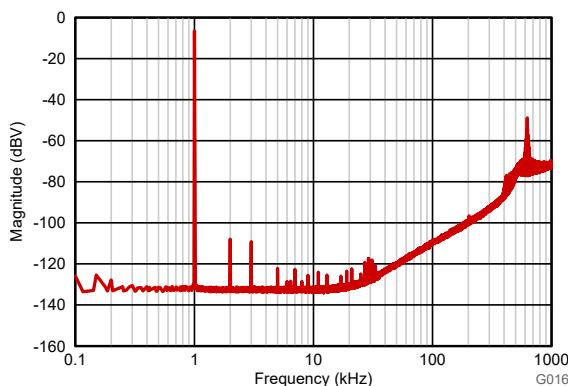


図 7-1. 量子化ノイズ成形

7.3.2 変調器

図 7-2 は、AMC0386-Q1 に実装されている 2 次スイッチトコンデンサ、フィードフォワード $\Delta\Sigma$ 変調器の概念を解説します。1 ビットのデジタル/アナログ コンバータ (DAC) の出力 V_5 が、入力電圧 $V_{IN} = (V_{SNSP} - V_{SNSN})$ から減算されます。この減算により、最初の積分器段の入力にアナログ電圧 V_1 が供給されます。最初の積分器の出力は、2 番目の積分器段の入力に供給されます。2 番目の積分の結果は、出力電圧 V_3 で、 V_{IN} および V_2 出力と加算されます。 V_{IN} は入力信号、 V_2 は最初の積分器です。その結果生成される電圧 V_4 の値に応じて、コンパレータの出力が変化します。この場合、1 ビット DAC は、次のクロック パルスで、関連するアナログ出力電圧 V_5 を変更することで応答します。そのため、積分器は逆方向へ進行し、積分器の出力値は強制的に入力の平均値をトラッキングします。

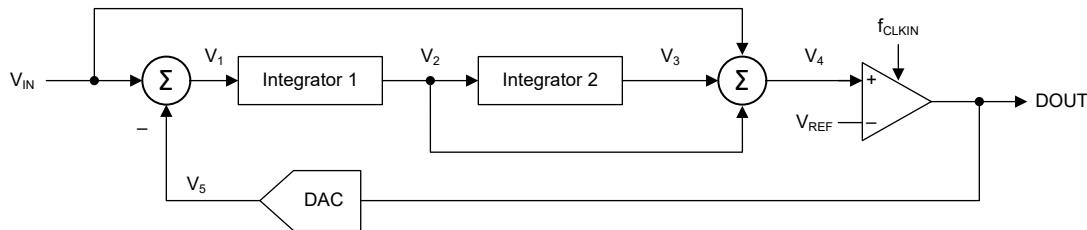


図 7-2. 2 次変調器のブロック図

7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送

図 7-3 に示されているように、AMC0386-Q1 は、オン / オフ キーイング (OOK) 変調方式を使用して、変調器の出力ビットストリームを、 SiO_2 ベースの絶縁膜間で伝送します。送信ドライバ (TX) をに [機能ブロック図](#) 示します。TX は、内部で生成された高周波キャリアを絶縁バリア越しに送信し、デジタル 1 を表現します。ただし、TX はデジタル 0 を表す信号を送信しません。AMC0386-Q1 で使用されるキャリアの公称周波数は 480MHz です。

AMC0386-Q1 の送信チャネルは、同相過渡耐性 (CMTI) を最大限に高め、放射妨害波を最小限に抑えるように最適化されています。高周波キャリアと RX/TX バッファのスイッチングにより、これらの放射が発生します。

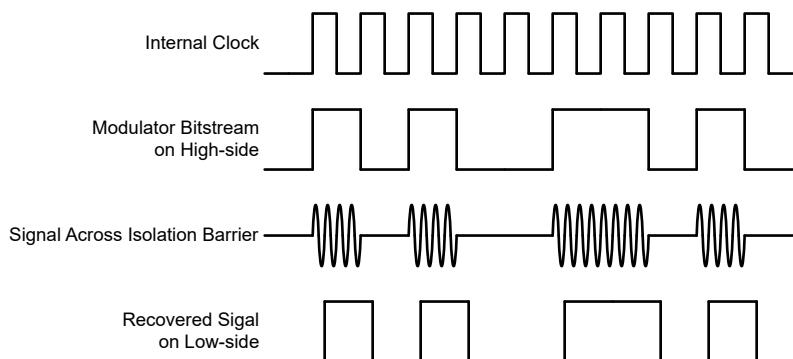


図 7-3. OOK ベースの変調方式

7.3.4 デジタル出力

入力信号の 0V は、理想的には時間のうち 50% が high である 1 と 0 のストリームを生成します。入力 1V ($V_{SNSP} - V_{SNSN}$) により、1 と 0 のストリームが生成されます。このストリームは時間のうち 90% が high です。分解能が 16 ビットであるため、このパーセンテージは理想的にはコード 58982 に対応します。入力信号の -1V は、理想的には時間のうち 10% が high である 1 と 0 のストリームを生成します。分解能が 16 ビットであるため、このパーセンテージは理想的にはコード 6554 に対応します。これらの入力電圧は、AMC0386-Q1 と規定された線形範囲でもあります。入力電圧の値がこの範囲を超えた場合、変調器の出力には非線形の動作が見られるようになります。量子化ノイズが増大します。変調器の出力は -1.25V の入力でゼロの一定ストリームをクリップします。変調器の出力も、 $\geq 1.25V$ の入力で一定のストリームをクリップします。ただしこの場合、AMC0386-Q1 は 128 クロック サイクルごとに 1 または 0 を生成し、デバイスが正しく機能していることを示します。入力が負のフルスケールにある場合、单一 1 が生成され、入力が正のフルスケールにある場合には 0 が生成されます。詳細については、「[フルスケール入力の場合の出力動作](#)」セクションを参照してください。入力電圧と、変調器の出力信号との関係を、図 7-4 に示します。

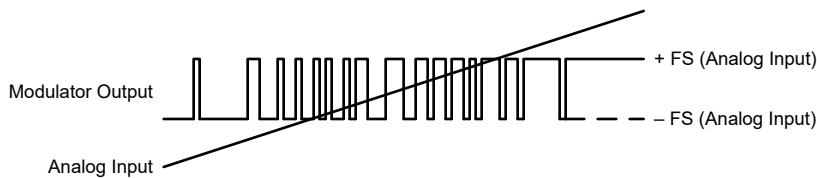


図 7-4. 変調器出力とアナログ入力の関係

次の式は、任意の入力電圧 $V_{IN} = (V_{SNSP} - V_{SNSN})$ の値について、出力ビットストリームの密度を計算します。唯一の例外は、フルスケール入力信号です。「[フルスケール入力の場合の出力動作](#)」セクションを参照してください。

$$\rho = (|V_{Clipping}| + V_{IN}) / (2 \times V_{Clipping}) \quad (1)$$

7.3.4.1 フルスケール入力の場合の出力動作

AMC0386-Q1 にフルスケール入力信号が印加された場合、デバイスは DOUT の 128 ビットごとに 1 または 0 を生成します。このプロセスのタイミング図を、図 7-5 に示します。検出される信号の実際の極性に応じて、单一の 1 または 0 が生成されます。フルスケール信号は、 $|V_{SNSP} - V_{SNSN}| \geq |V_{Clipping}|$ と定義されます。この方法により、AVDD が消失した状態と、フルスケール入力信号の状態とを、システムレベルで区別できます。デジタルビットストリームの診断に関するサンプルコードについては、「[C2000™ の構成可能ロジック ブロック \(CLB\) を使用したデルタシグマ変調器のビットストリームの診断](#)」アプリケーション ノートを参照してください。

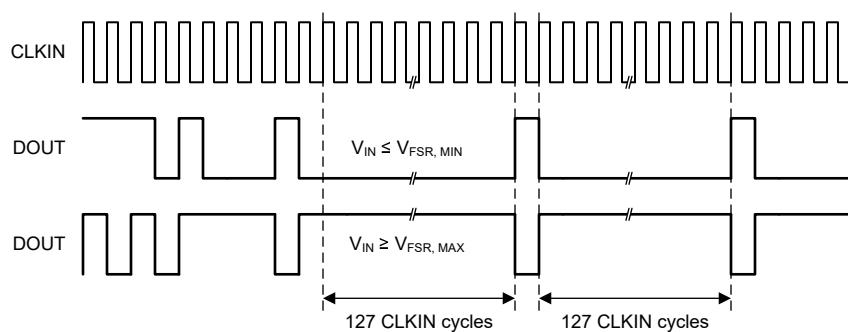


図 7-5. AMC0386-Q1 のフルスケール出力

7.3.4.2 ハイサイド電源が消失した場合の出力動作

ハイサイド電源 (AVDD) がない場合、デバイスは出力にロジック 0 の一定のビットストリームを提供し、DOUT は永続的に low です。このプロセスのタイミング図を、図 7-6 に示します。その 1 は 128 のクロック パルスごとに生成されるわけではなく、この状況が有効な負のフルスケール入力と区別されます。この機能は、基板上のハイサイド電源の問題を識別するのに役立ちます。デジタル ビット ストリームの診断に関するサンプルコードについては、『C2000™ の構成可能ロジック ブロック (CLB) を使用したデルタシグマ変調器のビット ストリームの診断』アプリケーション ノートを参照してください。

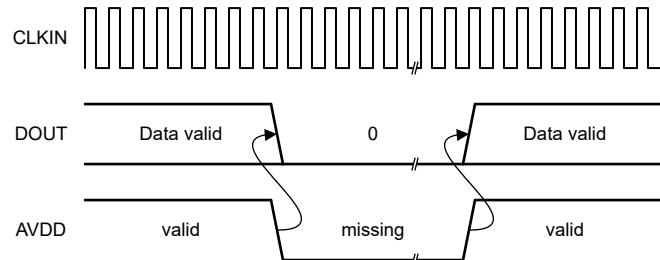


図 7-6. ハイサイド電源が消失した場合の AMC0386-Q1 の出力

7.4 デバイスの機能モード

AMC0386-Q1 は、次の状態のいずれかで動作します。

- OFF 状態: デバイスのローサイド (DVDD) が $DVDD_{UV}$ スレッショルドより低いです。デバイスが応答しません。OUT はハイインピーダンス状態。内部的に、OUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。
- ハイサイド電源喪失: デバイス (DVDD) のローサイドに電源が供給され、[推奨動作条件](#) に記載されている制限範囲内です。ハイサイド電源 (AVDD) は $AVDD_{UV}$ スレッショルドを下回っています。このデバイスは、[ハイサイド電源が消失した場合の出力動作](#) セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビットストリームを出力します。
- アナログ入力オーバーレンジ (正のフルスケール入力): AVDD および DVDD は推奨動作条件の範囲内です。ただし、アナログ入力電圧 $V_{IN} = (V_{SNSP} - V_{SNSN})$ は最大クリッピング電圧 ($V_{Clipping, MAX}$) を上回っています。[フルスケール入力の場合の出力動作](#) セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。
- アナログ入力アンダーレンジ (負のフルスケール入力): AVDD および DVDD は推奨動作条件の範囲内です。ただし、アナログ入力電圧 $V_{IN} = (V_{SNSP} - V_{SNSN})$ は最小クリッピング電圧 ($V_{Clipping, MIN}$) を下回っています。[フルスケール入力の場合の出力動作](#) セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。
- 通常動作の場合: AVDD、DVDD、 V_{IN} は推奨動作条件内です。このデバイスは、[デジタル出力](#) セクションで説明されているように、デジタルビットストリームを出力します。

表 7-1 に、動作モードを示します。

表 7-1. デバイスの動作モード

オペラティナルモード	AVDD	DVDD	V_{IN}	デバイスの応答
オフ	未使用	$V_{DVDD} < DVDD_{UV}$	未使用	OUT はハイインピーダンス状態。内部的に、OUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。
ハイサイド電源喪失	$V_{AVDD} < AVDD_{UV}$	有効 ⁽¹⁾	未使用	このデバイスは、 ハイサイド電源が消失した場合の出力動作 セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビットストリームを出力します。
入力オーバーレンジ	有効 ⁽¹⁾	有効 ⁽¹⁾	$V_{IN} > V_{Clipping, MAX}$	フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。
アンダーレンジ入力	有効 ⁽¹⁾	有効 ⁽¹⁾	$V_{IN} < V_{Clipping, MIN}$	フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。
通常動作	有効 ⁽¹⁾	有効 ⁽¹⁾	有効 ⁽¹⁾	通常動作

(1) *Valid* は、値が推奨動作条件の範囲内にあることを示します。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

オンボードチャージャ (OBC) などの AC 電源システムは、2 つ以上の電圧ドメインに分割され、互いに電気的に絶縁されています。たとえば、1 つの高電圧ドメインに、AC グリッド、DC リンク、力率補正 (PFC) 用の電力段が含まれます。2 つ目の高電圧ドメインには、DC バスと高電圧バッテリが含まれています。PFC コントローラは DC リンク (-) を基準としており、機能上の理由から AC 商用電源から電気的に絶縁された状態で AC ライン電圧の値を測定します。AMC0386-Q1 は、入力インピーダンスが高く、ガルバニック絶縁された出力を備えているため、この測定を可能にします。

8.2 代表的なアプリケーション

デバイス 1、デバイス 2、デバイス 3 の 3 つの AMC0386-Q1 デバイスは、それぞれ位相 L1、L2、L3 に直接接続されています。以下の画像はこの接続を示しています。絶縁バリアの反対側には、各デバイスが位相-中性点電圧を表すシリアルビットストリームを出力します。共通の AVDD 電源は、絶縁型 DC/DC コンバータ回路によって低電圧側から生成されます。低コストのデザインでは、プッシュプルドライバ SN6501-Q1 と、目的の絶縁電圧定格をサポートするトランジスタを使います。

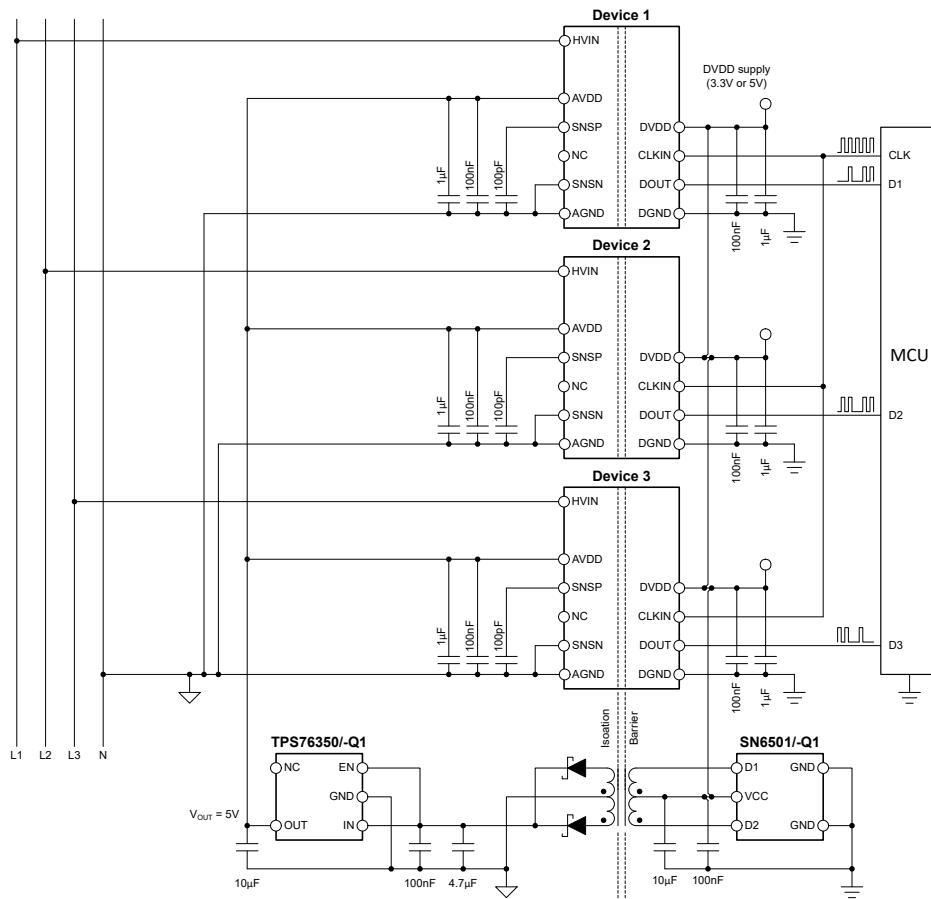


図 8-1. 代表的なアプリケーションでを使用 AMC0386-Q1

8.2.1 設計要件

表 8-1 に、この代表的なアプリケーションのパラメータを一覧します。

表 8-1. 設計要件

パラメータ	値
システム入力電圧 (位相から中性点へ)	230V _{RMS} ±10%、50Hz
ハイサイド電源電圧	5V
ローサイド電源電圧	3.3V

8.2.2 詳細な設計手順

この例でのピークラインから中性線への電圧は、 $230V \times \sqrt{2} \times 1.1 = 360V$ です。最良の測定分解能を得るには、AMC0386-Q1 ファミリのデバイスを、ピーク入力電圧と最も近いリニア入力範囲で選択します。AMC0386M06-Q1 は、±600V のリニア入力範囲をサポートしており、アプリケーションに適しています。HVIN を位相電圧に直接、GND1 をニュートラルに接続します。図 1-1 を参照してください。

8.2.2.1 入力フィルタの設計

フィルタコンデンサを SNSP ピンに接続して、信号路の信号対雑音比性能を向上させます。 $\Delta\Sigma$ 変調器のサンプリング周波数に近い周波数 (通常は 10MHz) の入力ノイズは、変調器によって低周波数の範囲にフォールドバックされます。RC フィルタの目的は、高周波ノイズを測定に必要なノイズ レベルを下回るように減衰させることです。実際には、変調器の周波数より 2 枚低いカットオフ周波数を使用すると、良好な結果が得られます。

入力フィルタのカットオフ周波数は、内部検出抵抗 R2 と外付けフィルタコンデンサ C5 により決定されます。カットオフ周波数は $1/(2\pi R2 C5)$ として計算されます。

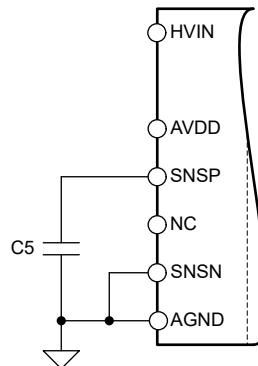


図 8-2. 入力フィルタ

8.2.2.2 ビットストリーム フィルタリング

変調器は、デジタル フィルタによって処理され、入力電圧に比例するデジタルワードを取得するビットストリームを生成します。[式 2](#) に sinc^3 タイプ フィルタを示します。このフィルタは、最小限の労力とハードウェアで構築される、非常にシンプルなフィルタです。

$$H(z) = \left(\frac{1 - z^{-\text{OSR}}}{1 - z^{-1}} \right)^3 \quad (2)$$

このフィルタは 2 次変調器用に、最も小さなハードウェア(デジタル ゲート数)で、最良の出力性能が得られます。本書に記載されているすべての特性は、 sinc^3 フィルタでも測定されています。このフィルタは、オーバー サンプリング比 (OSR) が 256、出力ワード幅は 16 ビットです。

[『ADS1202 と FPGA デジタル フィルタとの組み合わせによるモータ制御アプリケーションでの電流測定』アプリケーション ノート](#) には、サンプル コードが提供されています。このサンプル コードでは、FPGA に sinc^3 フィルタを実装しています。このアプリケーション ノートは、www.ti.com からダウンロードできます。

変調器の出力するビットストリームのフィルタ処理には、テキサス インスツルメンツの C2000 または Sitara マイコン ファミリのデバイスをお勧めします。これらのファミリは、チャネルごとに 2 つのフィルタ処理パスを提供することで、システム レベルの設計を大幅に簡素化する、マルチチャネルの専用ハードワイヤード フィルタ構造をサポートしています 1 つのパスは制御ループの高精度結果をもたらし、もう 1 つのパスは過電流検出の高速応答パスです。

[デルタシグマ変調器のフィルタ カリキュレータ](#) は、www.ti.com からダウンロードできます。このカリキュレータは、フィルタの設計と、目的の出力分解能とフィルタ応答時間を実現するための適切な OSR とフィルタの選択に役立ちます。

8.2.2.3 アプリケーション曲線

多くの場合、ADC と $\Delta\Sigma$ 変調器の性能を比較するには、実効ビット数(ENOB)が使用されます。次の図は、各種のオーバーサンプリング率における AMC0386-Q1 の ENOB を示します。

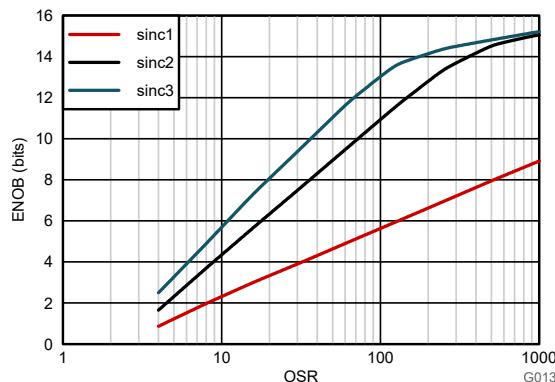


図 8-3. 測定された実効ビット数とオーバー サンプリング率との関係

8.3 設計のベスト プラクティス

HVIN ピンと SNSP ピンの間に何らかのリーク電流を避けます。リークージ電流は、測定誤差に大きくつながる可能性があります。レイアウトの推奨事項については、[レイアウト例](#)を参照してください。

8.4 電源に関する推奨事項

一般的なアプリケーションでは、AMC0386-Q1 のハイサイド電源 (AVDD) は、絶縁型 DC/DC コンバータによってローサイド電源 (DVDD) から生成されます。低コストのオプションでは、プッシュプル ドライバ [SN6501-Q1](#) と、目的の絶縁電圧定格をサポートするトランジストを使います。

AMC0386-Q1 は、特定の起動シーケンスを必要としません。ハイサイド電源 (AVDD) は、低 ESR の $1\mu\text{F}$ コンデンサ (C2) と並列接続された低 ESR の 100nF コンデンサ (C1) でデカップリングされます。ローサイド電源 (DVDD) は、低 ESR の $1\mu\text{F}$ コンデンサ (C4) と並列接続された低 ESR の 100nF コンデンサ (C3) で同様にデカップリングされます。4 つのコンデンサ (C1, C2, C3, C4) はすべてデバイスのできるだけ近くに配置します。図 8-4 に、AMC0386-Q1 のデカップリング回路図を示します。

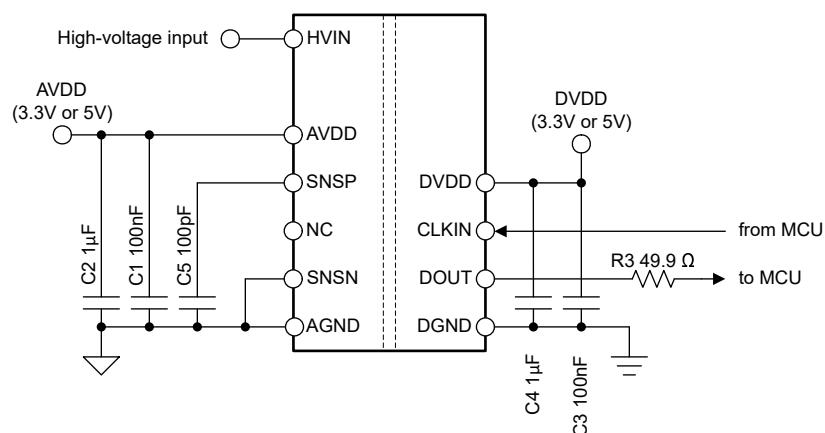


図 8-4. AMC0386-Q1 のデカップリング

アプリケーションで発生する DC バイアス条件の下で、コンデンサは十分な実効容量を提供することを確認します。マルチレイヤ セラミック コンデンサ (MLCC) は通常、実際の使用条件下における容量は、公称容量よりはるかに小さい値となります。これらのコンデンサを選択する際は、これらの要素を考慮してください。この問題は、背の高い部品よりも絶縁体電

界強度が高くなる薄型コンデンサで特に深刻です。信頼できるコンデンサ メーカーは、部品選択を非常に簡単にする容量対 DC バイアス曲線を提供しています。

8.5 レイアウト

8.5.1 レイアウトのガイドライン

「[レイアウト例](#)」セクションには、重要なデカップリングコンデンサとフィルタコンデンサの配置について詳しく説明したレイアウトの推奨事項が記載されています。デカップリングおよびフィルタコンデンサは、AMC0386-Q1 入力ピンにできる限り近づけて配置してください。

SNSP ピンの周囲にガードリングを配置し、ガードリングを AGND に接続します。ガードリングにより、HVIN と SNSP の間でリーク電流が並列電流パスを形成することを防止します。ガードリングがデバイスの下に部分的に配線されているため、高電圧側と低電圧側の間の空間距離が短くなります。ピン 7 と 8 の周囲にキープアウトゾーンを配置し (どちらのピンも内部接続されていない)、8mm を超えるクリアランス距離を回復します。

高電圧側と低電圧側の間の沿面距離を最大化するには、推奨レイアウトに示すように、ピン 15 の周囲に別の禁止ゾーンを配置します。

8.5.2 レイアウト例

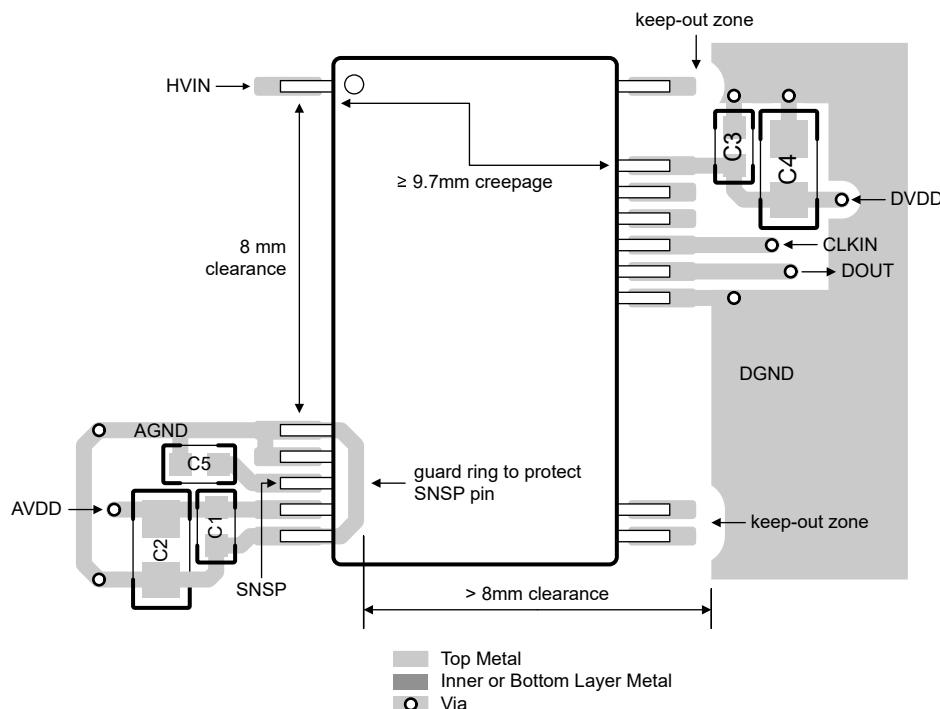


図 8-5. AMC0386-Q1 の推奨レイアウト

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス インスツルメンツ、『絶縁の用語集』アプリケーション ノート
- テキサス インスツルメンツ、半導体およびIC パッケージの熱評価基準アプリケーション ノート
- テキサス インスツルメンツ、『ISO72x デジタル アイソレータの磁界耐性』アプリケーション ノート
- テキサス インスツルメンツ、『ADS1202 と FPGA デジタル フィルタとの組み合わせによるモータ制御アプリケーション での電流測定』アプリケーション ノート
- テキサス インスツルメンツ、デルタシグマ変調フィルタ カリキュレータ設計ツール

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (October 2024) to Revision A (September 2025)

Page

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • ドキュメントのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更 | 1 |
|-----------------------------------|---|

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのプラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ（データシートを含みます）、設計リソース（リファレンス デザインを含みます）、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいづれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
AMC0386M06QDFXRQ1	Active	Production	SSOP (DFX) 15	750 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-	AMC0386M06Q
AMC0386M10QDFXRQ1	Active	Production	SSOP (DFX) 15	750 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	AMC0386M10Q
PAMC0386M10QDFXRQ1	Active	Preproduction	SSOP (DFX) 15	750 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

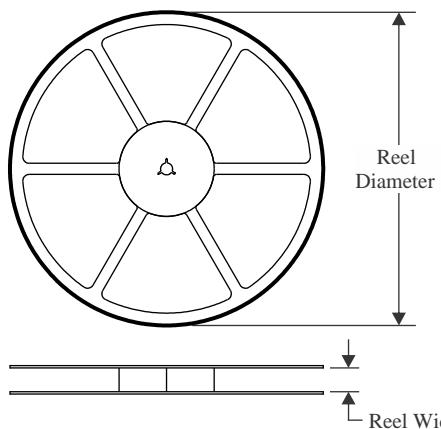
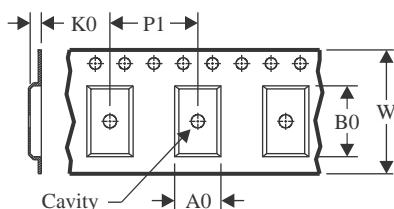
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF AMC0386-Q1 :

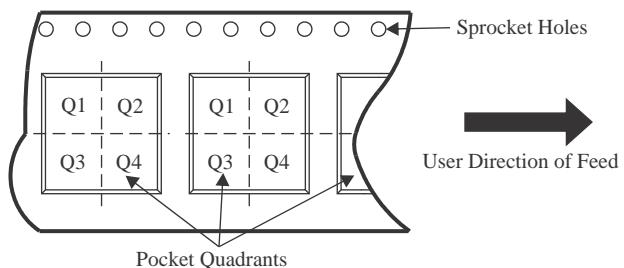
- Catalog : [AMC0386](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

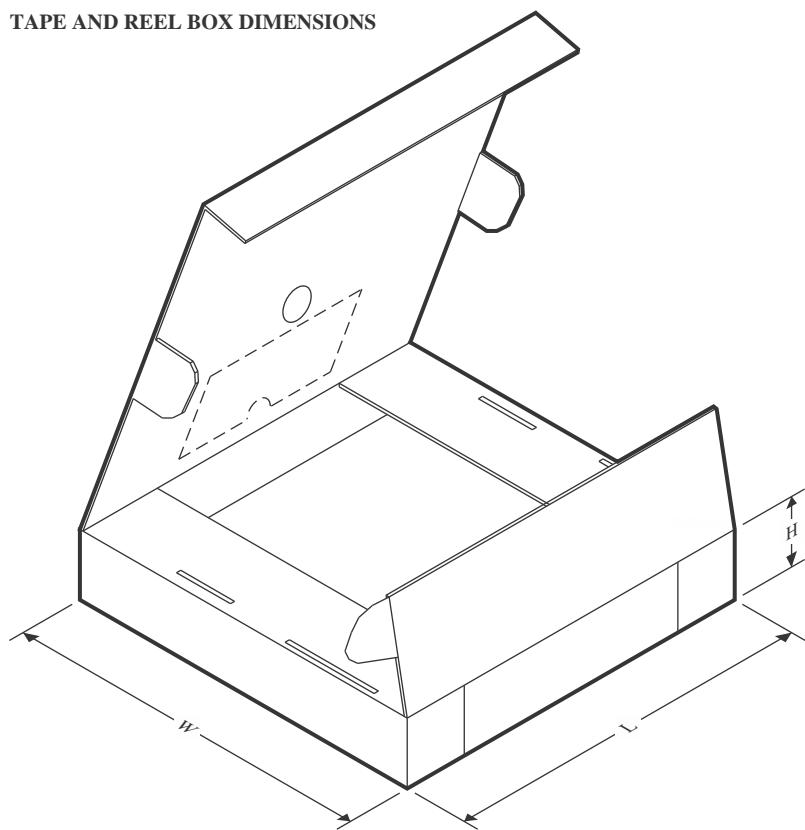
TAPE AND REEL INFORMATION
REEL DIMENSIONS

TAPE DIMENSIONS


A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
AMC0386M06QDFXRQ1	SSOP	DFX	15	750	330.0	24.4	10.85	13.4	4.0	16.0	24.0	Q1
AMC0386M10QDFXRQ1	SSOP	DFX	15	750	330.0	24.4	10.85	13.4	4.0	16.0	24.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
AMC0386M06QDFXRQ1	SSOP	DFX	15	750	350.0	350.0	43.0
AMC0386M10QDFXRQ1	SSOP	DFX	15	750	350.0	350.0	43.0

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月